

アンリツ製計測器の エージングレポートのご提案

計測器を仕様範囲内の状態で使い続けるために

特許出願中 (特許公開公報 公開済み)

■ こんな困りごとありませんか？

校正に出したら「規格を外れています、修理しますか？」という連絡があった。

「そういえば生産ラインで歩留まりが悪化している報告があったがこれが原因？」当該機を使用していたラインでの影響範囲の調査や是正対策に時間をついやした。



電子機器は時間が経過すると、測定環境やコンポーネントの経年変化によって、ドリフトが発生する可能性があります。



ドリフトが発生して規格範囲外となった場合、前回から今回までの間の測定は、規格範囲外の状態での測定したことになり、測定結果への影響が懸念されます。

■ 課題

校正は毎年実施しているが。。。

- ・ 生産設備を校正の度に前回、前々回と比較するのはコストと時間が掛かる。
- ・ 計測器の状態変化は何となく悪化傾向にあるが、定量的に判断出来ない。
- ・ 管理する部門を作るにも専門知識とリソースが必要。

■ 課題解決

校正の目的とは？

- ・ **これから行う測定の妥当性**の確認、**過去の測定結果の妥当性**の確認の2点です。

計測器の校正は、使用期間を挟んで使用前と使用後で合計2回実施することが必要です。

提案

「エージングレポート」は

- ✓ これまで蓄積してきた校正結果を元に、機種群毎の経年変化を分析し計測器の現時点の状態を可視化。
- ✓ 分析結果をもとに校正周期の変更、調整、修理診断のすすめ等アドバイスいたします。

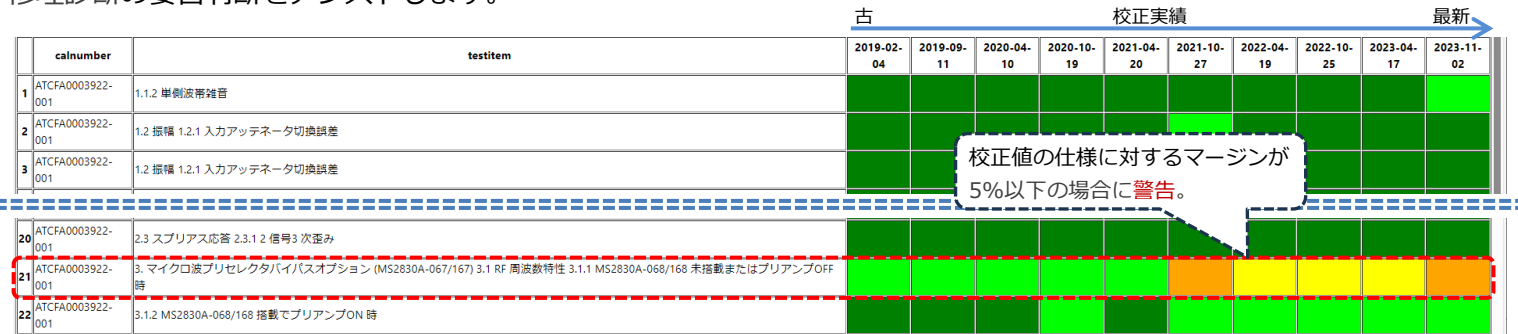
計測器の不具合(or故障)が発生した時の**コスト**を抑え計画的な生産計画の立案に役立ちます。

■ エージングレポートのご紹介

計測器の「健康状態」のトレンドを可視化したエージングレポートをご提供いたします！

Spec margin map for test item

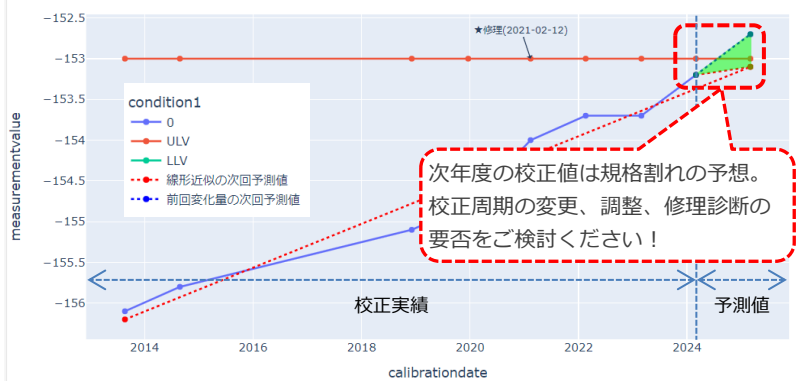
多数ある校正項目/校正ポイントについて、校正値の仕様に対するマージンを時系列のヒートマップ形式でご提供。仕様に対するマージンの少ない項目を一目で見つけられ、お客様の製品に問題が起きる前に、校正周期の変更、調整、修理診断の要否判断をアシストします。



[図1] 校正データのヒートマップ イメージ (赤色に近いほど規格割れに近い)

Trend Graphs

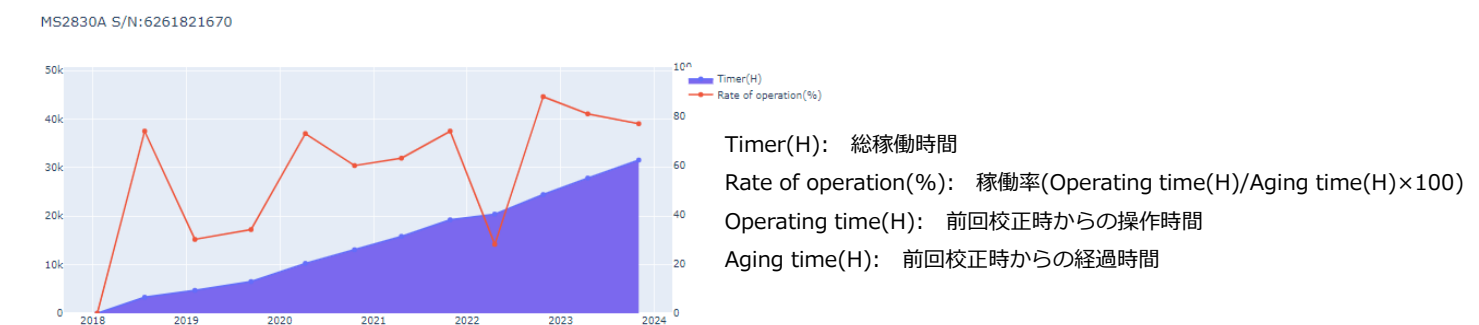
図2は、特定の校正項目で規格値に対する余裕が少なくなってきた実機の校正データです。エージングレポートでは、過去データから予測値を参考値として示します。もし、ここで次回校正で規格割れが予想される場合、校正周期の変更、調整、修理診断をぜひご確認ください。



[図2] 校正データのトレンドと予測値 イメージ

Operating Time

累積稼働時間(青線)と校正期間毎の稼働率表示し、機器の稼働状況を確認することができます。



[図3] 累積稼働時間/校正期間ごとの稼働時間 イメージ

稼働率の高さから、計測器が不足か余剰であるかを判断する材料となります。

追加購入や、レンタル品への置き換えなど、状況に応じて稼働率データをご活用ください。

APC-J0Z-23043-03

アンリツカスタマーサポート株式会社

<https://www.anritsu.com/ja-jp/anritsu-customersupport>

営業計画部 営業チーム

TEL : 0120-214-012

Email(サービス全体): APC-sales@anritsu.com

受付時間

月曜日～金曜日(当社休業日を除く)

9:00～12:00, 13:00～17:00

ホームページ

